

2017

Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky –  
Část 6: Skladování při vysoké teplotě

ČSN  
EN 60749-6  
ed. 2  
35 8799

idt IEC 60749-6:2017

Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods –  
Part 6: Storage at high temperature

Dispositifs a semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –  
Partie 6: Stockage a haute température

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren –  
Teil 6: Lagerung bei hoher Temperatur

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60749-6:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60749-6:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-07 se nahrazuje ČSN EN 60749-6 (35 8799) z dubna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Účelem této normy je zkoušet a určit vliv skladování při zvýšené teplotě na všechny elektronické součástky bez použití elektrického namáhání. Tato zkouška se obvykle používá k určení vlivu času a teploty v podmínkách skladování, na tepelně aktivované metody poruch a určení času do poruchy elektronických součástek, včetně energeticky nezávislých paměťových zařízení (mechanismy selhání dat). Tato zkouška je považována za nedestruktivní, ale měla by být raději používána pro kvalifikaci součástek. Jestliže jsou takové součástky používány pro dodávku, bude třeba účinky této zkoušky velmi zrychleným namáháním vyhodnotit.

Tepelně aktivované metody poruch jsou modelovány pomocí Arrheniusovi rovnice. Návod pro výběr zkušebních teplot a dob trvání lze nalézt v IEC 60749-43.

Národní předmluva

## Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60749-6:2017 dovoleno do 2020-04-07 používat dosud platnou ČSN EN 60749-6 (35 8799) z dubna 2003.

## Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

- a) dodatečné zkušební podmínky;
- b) vyjasnění použitelnosti zkušebních podmínek.

## Souvisící ČSN

ČSN EN 60749-20 ed. 2 (35 8799) Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

## Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

## Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

**Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.**